•研究论文•

类硅烯 H₂C=SiLiBr 与 RH (R=F, OH, NH₂)的插入反应

李文佐*," 程建波*," 官宝安" 于健康", 孙家钟",

("烟台大学化学生物理工学院 烟台 264005) (⁶吉林大学理论化学计算国家重点实验室 长春 130012)

摘要 采用 DFT B3LYP 和 QCISD 方法研究了类硅烯 H₂C=SiLiBr 与 RH (R=F, OH, NH₂)的插入反应. 在 B3LYP/6-311+G(d,p)水平上优化了反应势能面上的驻点构型. 结果表明, H₂C=SiLiBr 与 HF, H₂O 或 NH₃发生插入反应的机理相 同. QCISD/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311+G(d,p)计算的三个反应的势垒分别为 148.62, 164.42 和 165.07 kJ•mol⁻¹, 反 应热分别为-69.63, -43.02 和-28.27 kJ•mol⁻¹. 相同条件下发生插入反应时,反应活性都是 H—F>H—OH> H—NH₂.

关键词 类硅烯 H₂C=SiLiBr; RH (R=F, OH, NH₂); 插入反应; DFT; QCISD

Insertion Reactions of the Silylenoid $H_2C=SiLiBr$ to RH (R=F, OH, NH₂)

Li, Wenzuo^{*,a} Cheng, Jianbo^{*,a} Gong, Baoan^a Yu, Jiankang^{a,b} Sun, Jiazhong^{a,b} (^a Science and Engineering College of Chemistry and Biology, Yantai University, Yantai 264005) (^b State Key Laboratory of Theoretical and Computational Chemistry, Jilin University, Changchun 130021)

Abstract The insertion reactions of the silylenoid $H_2C=SiLiBr$ to RH (R=F, OH, NH₂) were studied by using the DFT B3LYP and QCISD methods. The geometries of the stationary points on the potential energy surfaces of the reactions were optimized at the B3LYP/6-311+G (d,p) level of theory. The calculated results indicate that the mechanisms of the insertion reactions of $H_2C=SiLiBr$ to HF, H₂O, and NH₃ are identical to each other. The QCISD/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311+G(d,p) calculated potential energy barriers of the three reactions are 148.62, 164.42, and 165.07 kJ/mol, and the reaction energies for the three reactions are -69.63, -43.02, and -28.27 kJ/mol, respectively. Under the same situation, the insertion reactions should occur easily in the following order H—F>H—OH>H—NH₂.

Keywords silylenoid H₂C=SiLiBr; RH (R=F, OH, NH₂); insertion reaction; DFT; QCISD

类硅烯(Silylenoid)是类卡宾(Carbenoid)的类似物, 可以用通式 R¹R²SiMX (X 通常为卤素, M 通常为碱金 属)来表示.实验工作^[1~10]证实类硅烯化合物是一种重 要的有机硅反应中间体,在有机硅化合物的合成中发挥 着重要作用.因而类硅烯的结构、性质与反应性日益受 到人们的重视.由于仅靠实验工作尚不能全面理解类硅 烯的结构与反应机理,因此对类硅烯进行深入的理论研 究很有必要. 自从 1980 年 Clark 等^[11]通过对最简单的类 硅烯 H₂SiLiF 的理论计算预言了类硅烯的存在,现已较 系统地研究了类硅烯 H₂SiMX (M=Li, Na, K; X=F, Cl, Br), R₂SiLiF (R=CH₃, CH₂CH₃)以及 H₂C=SiMX (M= Li, Na; X=F, Cl, Br)各种可能的异构体构型、稳定性以 及各异构体之间的异构化反应^[12~24]. 这些工作对深入 理解类硅烯的结构、性质及反应性提供了重要的理论依

^{*} E-mail: liwenzuo2004@126.com; chengjb@126.com

Received January 23, 2008; revised October 10, 2008; accepted December 24, 2008. 烟台大学博士科研基金(Nos. HY05B30, HY05B36)及吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室开放课题(No. SKLSSM200713)资助项目.

据.关于类硅烯与其它物质的反应的研究尚不多见^[23(b)].而不饱和类硅烯 H₂C=SiMX 与其它物质的反应至今尚未见文献报道.最近,我们采用 DFT B3LYP^[25~28]和QCISD^[29,30]方法对H₂C=SiLiBr与RH(R =F, OH, NH₂)的插入反应进行了研究,可望提供不饱和类硅烯反应方面的理论信息,丰富类硅烯的研究内容,加深对此类有机活性中间体的认识.

1 计算方法

采用 DFT B3LYP 方法对 H₂C=SiLiBr 与 RH (R= F, OH, NH₂)的插入反应势能面上所有可能的驻点进行 全参数优化,并进行振动频率分析及 IRC^[31,32] (intrinsic reaction coordinate)计算以确证过渡态.以上计算选择 6-311+G(d,p)基组^[33].为进一步考虑相关能,在优化构 型上对各个物种进行了 QCISD/6-311++G(d,p)单点能 量计算.如无特殊说明,文中能量均指 QCISD/6-311+ +G(d,p)//B3LYP/6-311+G(d,p)水平上计算所得的能量 (表示为 QCISD 能量),并在 B3LYP/6-311+G(d,p)水平 上进行零点能校正.计算采用 Gaussian 03^[34]程序.

2 结果和讨论

类硅烯 H₂C=SiLiBr 与 RH (R=F, OH, NH₂)的插入 反应按下式进行:

$H_2C = SiLiBr + RH \rightarrow H_2C = SiRH + LiBr$

研究^[24]表明,类硅烯 H₂C=SiLiBr 有三种可能的平 衡构型,其中非平面的 *p*-配合物型构型能量最低,是其 存在的主要构型.因此,在研究类硅烯 H₂C=SiLiBr 与 RH (R=F, OH, NH₂)的插入反应时选取 *p*-配合物型构型 作为反应物.下文出现的 H₂C=SiLiBr 均指 *p*-配合物型 构型.计算发现,在发生插入反应时,先经历一个前驱 体复合物[H₂C=SiLiBr…RH](Q),然后经历一个过渡态 (TS)和一个中间体(IM)到达产物(P).B3LYP/6-311+ G(d,p)构型优化所得各个驻点的几何构型在图 1 给出. 各个驻点的相对能量在表 1 中给出.从图 1 可以看出在 B3LYP/6-311+G (d,p)水平上得到的 *p*-配合物型构型与 文献[24]报道的构型类似.H₂C=SiLiBr 和 RH 形成复合 物[H₂C=SiLiBr…RH]时各部分结构变化不大.

2.1 过渡态的构型与能量

从图 1 可以看出, H₂C=SiLiBr 与 RH (R=F, OH, NH₂)的插入反应有着结构相似的过渡态. 三个过渡态 (TS1, TS2 和 TS3)构型中, [H₂C…LiBr]部分结构类似. RH 攻击 Si 原子, 使得过渡态中存在一个三元环

(X—Si—H, X=F, O, N)结构部分(见图 1). 三个过渡态 中的 R—H 键键长均比反应物 RH 中的 R—H 键长长: TS1中, F—H键(0.1267 nm)比 HF 中 F—H键(0.0922 nm) 长 0.0345 nm; TS2 中, O—H(3)键(0.1300 nm)比 H₂O 中 O—H 键(0.0962 nm)长 0.0338 nm; TS3 中, N—H(3)键 (0.1414 nm)比 NH₃中 N—H 键(0.1015 nm)长 0.0399 nm. R—H 键的键长明显增大意味着该键将要断裂, 同时 Si—H 键和 Si—X 键将要形成.

频率分析计算表明, 三个过渡态均存在唯一的虚频. 在 B3LYP/6-311+G(d,p)水平上, TS1, TS2 和 TS3 的虚频分别为 1368.7i, 1532.4i 和 1553.1i cm⁻¹. IRC 计算表明, 过渡态连接反应物与中间体. 过渡态 TS1, TS2 和 TS3 相对于各自前驱体复合物(Q)的相对能量分别为 148.62, 164.42 和 165.07 kJ•mol⁻¹ (见表 1).

表 1 反应物、前驱体、过渡态、中间体和产物的相对能量 (kJ•mol⁻¹)^a

Table 1 The relative energies $(kJ \cdot mol^{-1})$ of reactants, precursor complexes (Q), transition states (TS), intermediates (IM), and products^{*a*}

Species	R = F	R = OH	$R = NH_2$
H ₂ C=SiLiBr+RH	12.67	7.29	3.16
Q	0.00	0.00	0.00
TS	148.62	164.42	165.07
IM	-191.05	-165.86	-143.01
H ₂ C=SiRH+LiBr	-56.96	-35.73	-25.11

^{*a*} at the QCISD/6-311++G(d, p)//B3LYP/6-311+G(d,p) level and including vibrational zero-point energy (ZPE, without scale) corrections determined at B3LYP/6-311+G(d,p) level.

2.2 中间体和产物的构型与能量

IM1, IM2 和 IM3 分别是三个插入反应的中间体(见 图 1). 从图 1 可以看出, 三个中间体中[H₂C…LiBr]部分 结构相似,而且与相应过渡态中的[H2C…LiBr]部分相 比变化不大. 比较中间体与对应过渡态的结构, 可以看 出,中间体的XSiH (X=F,O,N)键角明显大于过渡态的 XSiH 键角: IM1 的角 FSiH (107.7°)比 TS1 的角 FSiH (36.4°)大71.3°; IM2的角OSiH (112.9°)比TS2的角OSiH (42.0°)大70.9°; IM3 的角 NSiH (110.4°)比 TS3 的角 NSiH (46.8°)大 63.6°. 中间体构型中, R-H(3)键已完全断裂. 三个中间体中的 Si-H 键和 Si-X (X=F, O, N)键均比 各自对应的过渡态中的 Si—H 和 Si—X 键短: IM1 中 Si-H键(0.1475 nm)比 TS1 中 Si-H键(0.1603 nm)短 0.0128 nm, Si-F 键(0.1629 nm) 比 TS1 中 Si-F 键 (0.2128 nm) 短 0.0499 nm; IM2 中 Si—H 键(0.1479 nm) 比 TS2 中 Si-H 键(0.1641 nm)短 0.0162 nm, Si-O 键 (0.1655 nm) 比 TS2 中 Si-O 键(0.1917 nm) 短 0.0262 nm; IM3 中 Si—H 键(0.1475 nm)比 TS3 中 Si—H 键



图 1 B3LYP/6-311+G(d,p)优化的各驻点的构型

Figure 1 The geometries of the stationary points calculated at B3LYP/6-311+G(d,p) level (bond lengths in nm, bond angles in degree)

(0.1627 nm)短 0.0152 nm, Si—N 键(0.1712 nm) 比 TS3 中 Si—N 键(0.1883 nm) 短 0.0171 nm. 说明 Si—H 和 Si—X 键已经基本形成. IM1, IM2 和 IM3 相对于各自前 驱体复合物(Q)的相对能量分别为-191.05, -165.86 和 -143.01 kJ•mol⁻¹ (见表 1).

P1, P2 和 P3 分别是三个中间体 IM1, IM2 和 IM3 解 离掉 LiBr 后的产物. 计算表明, 解离过程为能量单调升 高的无势垒过程. P1 为平面构型, 属于 *Cs* 点群. P1 中 Si—H 键(0.1468 nm)比 IM1 中 Si—H 键(0.1475 nm)短 0.0007 nm, Si—F 键(0.1619 nm)比 IM1 中 Si—F 键 (0.1629 nm)短 0.0010 nm, Si—C 键(0.1690 nm)比 IM1 中 Si—C 键(0.1767 nm)短 0.0077 nm. P2 也为平面构型, 其 中 H(3)与 H(4)原子在 O—Si 键的同侧. P2 中 Si—O 键与 IM2 中 Si—O 键基本相等, Si—H 键(0.1476 nm)比 IM2 中 Si—H 键(0.1479 nm)短 0.0003 nm, Si—C 键(0.1694 nm)比 IM2 中 Si—C 键(0.1763 nm)短 0.0069 nm. P3 也是 平面结构. P3 中 Si—H 键比 IM3 中 Si—H 键略短, Si—N 键(0.1708 nm)比 IM3 中 Si—N 键(0.1712 nm)短 0.0004 nm, Si—C 键(0.1701 nm)比 IM3 中 Si—C 键(0.1771 nm) 短 0.0070 nm. 从表 1 可以看出, 三个插入反应的产物 (H₂C=SiRH+LiBr)能量均比前驱体复合物(Q)能量低: 相对于各自前驱体复合物(Q)的相对能量分别为 -56.96, -35.73 和-25.11 kJ•mol⁻¹ (见表 1).

2.3 插入反应的机理分析

以 H₂C=SiLiBr 与 HF 反应为例. 以计算的 TS1 为 起始点,在 B3LYP/6-311+G(d,p)水平上沿着反应途径 分别向前和向后进行了 30 个点的 IRC 计算,所用步长 为 0.15 a.u. 图 2 给出了 IRC 计算所得的能量及键长随



图 2 H₂C=SiLiBr 与 HF 反应的能量和键长随反应坐标的变 化曲线

Figure 2 Potential energy and bond distances profile along the reaction coordinates for the reaction of H_2C =SiLiBr and HF

反应坐标变化的曲线图. 从图 2 可以很直观地看出, 随着插入反应的进行, F—H(3)键逐渐拉长乃至断裂. Si—F 键和 Si—H(3)键逐渐缩短.

反应过程各个驻点的原子上的电荷变化可以反映 反应机理. 在 B3LYP/6-311+G(d,p)水平上计算了各个 前驱体复合物、过渡态、中间体和产物的 Mulliken 电荷. 结果发现, 过渡态中的 X (X=F, O, N)原子和 H(3)原子 上的电荷都比它们在复合物中更负, Si 原子上的电荷则 比在复合物中更正. 中间体中的 X (X=F, O, N)原子和 H(3)原子上的电荷都比它们在过渡态中更负. 这同样可 以反映出反应过程中 X—H 键的断裂和 Si—H 与 Si—X 键的生成.

2.4 三个插入反应的比较

图 3 给出了三个插入反应的势能面示意图. 从图 3 可以看出, H₂C=SiLiBr 与 RH (R=F, OH, NH₂)发生插 入反应的机理相同,但反应的难易程度不同. QCISD/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-311+G(d,p)计算的 H₂C=SiLiBr 与 HF, H₂O 和 NH₃ 插入反应的势全分别为 148.62,164.42 和 165.07 kJ·mol⁻¹,反应热分别为 -69.63, -43.02 和 -28.27 kJ·mol⁻¹. 因此,不管是从 热力学角度还是从动力学角度看,在相同条件下发生插 入反应时,反应活性都是 H—F>H—OH>H—NH₂,即 相同条件下, HF 最容易与 H₂C=SiLiBr 发生插入反应, H₂O 次之, NH₃则最难.这与 RH 中 H 原子上的电荷分 布情况相一致:B3LYP/6-311+G (d,p)计算的 HF, H₂O 和 NH₃ 的 H 原子上的 Mulliken 电荷分别为 0.286e, 0.253e 和 0.227e, 当发生类似的亲核反应时,反应活性 应该是 H—F>H—OH>H—NH₂.



图 3 H₂C=SiLiBr 与 RH (R=F, OH, NH₂)插入反应势能面示 意图

Figure 3 The schematic pathways for the insertion reactions of $H_2C=SiLiBr$ and RH (R=F, OH, NH₂)

3 结论

应用 DFT B3LYP 和 QCISD 方法研究了不饱和类硅 烯 H₂C=SiLiBr 与 RH (R=F, OH, NH₂)的插入反应. 结 果表明, H₂C=SiLiBr 与 HF, H₂O 或 NH₃发生插入反应 的机理相同:反应历程均经过一个带有三元环结构部分 的过渡态和一个中间体到达产物.相同条件下, HF 最容 易与H₂C=SiLiBr 发生插入反应, H₂O 次之, NH₃则最难. 本文对深入理解类硅烯的反应性提供了有用信息.

References

- Boudjouk, P.; Samaraweera, U. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1988, 27, 1355.
- 2 Miller, R. D.; Michl, J. *Chem. Rev.* **1989**, *89*, 1359, and references therein.
- 3 (a) Tamao, K.; Kawachi, A. Organometallics 1995, 14, 3108.

(b) Tamao, K.; Kawachi, A. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1995, 34, 818.

(c) Kawachi, A.; Doi, N.; Tamao, K. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 233.

(d) Tamao, K.; Kawachi, A.; Asahara, M.; Toshimitsu, A. *Pure Appl. Chem.* **1999**, *71*, 393.

(e) Tamao, K.; Asahara, M.; Saeki, T.; Toshimitsu, A. Angew. Chem., Int. Ed. 1999, 38, 3316.

(f) Tamao, K.; Asahara, M.; Saeki, T.; Toshimitsu, A. J. Organomet. Chem. **2000**, 600, 118.

(g) Kawachi, A.; Oishi, Y.; Kataoka, T.; Tamao, K. Organometallics **2004**, 23, 2949.

4 (a) Tokitoh, N.; Hatano, K.; Sadahiro, T.; Okazaki, R. *Chem. Lett.* 1999, 931.
(b) Hatano, K.; Tokitoh, N.; Takagi, N.; Nagase, S. *J. Am.*

Chem. Soc. **2000**, *122*, 4829.

(c) Tajima, T.; Hatano, K.; Sasaki, T.; Sasamori, T.; Takeda, T.; Tokitoh, N.; Takagi, N.; Nagase, S. J. Organomet. *Chem.* **2003**, *686*, 118.

- 5 Sekiguchi, A.; Lee, V. Y.; Nanjo, M. Coord. Chem. Rev. 2000, 210, 11.
- 6 (a) Wiberg, N.; Niedermayer, W. J. Organomet. Chem. 2001, 628, 57.
 (b) Wiberg, N.; Niedermayer, W.; Fischer, G.; Noth, H.; Suter, M. Eur. J. Inorg. Chem. 2002, 1066.
- 7 Driver, T. G.; Franz, A. K.; Woerpel, K. A. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 6524.
- 8 (a) Weidenbruch, M. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 4241.

(b) Weidenbruch, M. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 4539.

- 9 (a) Lee, M. E.; Cho, H. M.; Ryu, M. S.; Kim, C. H.; Ando, W. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 7732.
 (b) Lee, M. E.; Cho, H. M.; Lim, Y. M.; Choi, J. K.; Park, C. H.; Jeong, S. E.; Lee, U. Chem. Eur. J. 2004, 10, 377.
 (c) Lim, Y. M.; Cho, H. M.; Lee, M. E.; Baeck, K. K. Organometallics 2006, 25, 4960, and references therein.
- Molev, G.; Bravo-Zhivotovskii, D.; Karni, M.; Tumanskii, B.; Botoshansky, M.; Apeloig, Y. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 2784.
- 11 Clark, T.; Schleyer, P. J. Organomet. Chem. 1980, 191, 347.
- 12 (a) Feng, S.-Y.; Ju, G.-Z.; Deng, C.-H. *Chin. J. Chem.* **1991**, *9*, 16.

(b) Feng, S.-Y.; Feng, D.-C.; Deng, C.-H. Chem. Phys. Lett. **1993**, 214, 97.

(c) Feng, D.-C.; Feng, S.-Y.; Deng, C.-H. Chin. J. Chem. **1995**, *13*, 481.

(d) Feng, S.; Feng, D.; Li, J. Chem. Phys. Lett. 2000, 316, 146.

(e) Feng, S.-Y.; Feng, D.-C.; Li, M.-J.; Bu, Y.-X. Chem. Phys. Lett. 2001, 339, 103.

(f) Feng, S.; Feng, D. J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 2001, 541, 171.

(g) Feng, S.-Y.; Feng, D.-C.; Li, M.-J.; Zhou, Y.-F. Int. J. Quantum Chem. 2002, 87, 360.

(h) Feng, S.; Zhou, Y.; Feng, D. J. Phys. Chem. A 2003, 107, 4116.

- 13 Feng, S.-Y.; Ju, G.-Z.; Deng, C.-H. Sci. China, B 1992, 35(5), 523.
- 14 Feng, D.; Xie, J.; Feng, S. Chem. Phys. Lett. 2004, 396, 245.
- 15 Feng, S.-Y.; Deng, C.-H. *Acta Chim. Sinica* **1993**, *51*, 138 (in Chinese).

(冯圣玉, 邓从豪, 化学学报, 1993, 51, 138.)

- Feng, D.-C.; Feng, S.-Y.; Deng, C.-H. Chem. J. Chin. Univ. 1996, 17, 1108 (in Chinese). (冯大诚, 冯圣玉, 邓从豪, 高等学校化学学报, 1996, 17, 1108.)
- Feng, D.-C.; Feng, S.-Y.; Deng, C.-H. Chem. J. Chin. Univ. 1998, 19, 451 (in Chinese).
 (冯大诚, 冯圣玉, 邓从豪, 高等学校化学学报, 1998, 19, 451.)
- 18 Tanaka, Y.; Hada, M.; Kawachi, A.; Tamao, K.; Nakatsuji, H. Organometallics 1998, 17, 4573.
- 19 Flock, M.; Dransfeld, A. Chem. Eur. J. 2003, 9, 3320.

- 20 Wang, H.-J.; Xie, J.; Feng, D.-C.; Feng, S.-Y. Chem. J. Chin. Univ. 2004, 25, 2070 (in Chinese).
 (王焕杰, 解菊, 冯大诚, 冯圣玉, 高等学校化学学报, 2004, 25, 2070.)
- 21 Flock, M.; Marschner, C. Chem. Eur. J. 2005, 11, 4635.
- Li, W.-Z.; Gong, B.-A.; Cheng, J.-B. Acta Phys.-Chim. Sin.
 2006, 22(6), 653 (in Chinese).
 (李文佐, 宫宝安, 程建波, 物理化学学报, 2006, 22(6), 653.)
- (a) Xie, J.; Feng, D.; Feng, S.; Zhang, J. J. Mol. Struct. (*THEOCHEM*) 2005, 755, 55.
 (b) Xie, J.; Feng, D.; Feng, S. Struct. Chem. 2006, 17, 63.
 (c) Xie, J.; Feng, D.; Feng, S. J. Comput. Chem. 2006, 27, 933.
 (d) Xie, J.; Feng, D.; Feng, S.; Ding, Y. Struct. Chem. 2007, 18, 65.
- 24 Li, W.-Z.; Gong, B.-A.; Cheng, J.-B.; Xiao, C.-P. Acta Chim. Sinica 2007, 65, 1573 (in Chinese).
 (李文佐, 宫宝安, 程建波, 肖翠平, 化学学报, 2007, 65, 1573.)
- 25 Hohenberg, P.; Kohn, W. Phys. Rev. 1964, 136, B864.
- 26 Feller, D. J. Chem. Phys. 1990, 93, 579.
- 27 Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648.
- 28 Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G. Phys. Rev. 1988, B37, 785.
- 29 Gauss, J.; Cremer, C. Chem. Phys. Lett. 1988, 150, 280.
- 30 Salter, E. A.; Trucks, G. W.; Bartlett, R. J. J. Chem. Phys. 1989, 90, 1752.
- 31 Gonzalez, C.; Schlegel, H. B. J. Chem. Phys. 1989, 90, 2154.
- 32 Gonzalez, C.; Schlegel, H. B. J. Phys. Chem. 1990, 94, 5523.
- 33 Hehre, W. J.; Radom, L.; Schleyer, P. V. R.; Pople, J. A. Ab Initio Molecular Orbital Theory, Wiley, New York, 1986.
- 34 Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Montgomery, J. A.; Vreven, T. Jr.; Kudin, K. N.; Burant, J. C.; Millam, J. M.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; Barone, V.; Mennucci, B.; Cossi, M.; Scalmani, G.; Rega, N.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Klene, M.; Li, X.; Knox, J. E.; Hratchian, H. P.; Cross, J. B.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; Yazvev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Ayala, P. Y.; Morokuma, K.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Zakrzewski, V. G.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Strain, M. C.; Farkas, O.; Malick, D. K.; Rabuck, A. D.; Raghavachari, K.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Cui, Q.; Baboul, A. G.; Clifford, S.; Cioslowski, J.; Stefanov, B. B.; Liu, G.; Liashenko, A.; Piskorz, P.; Komaromi, I.; Martin, R. L.; Fox, D. J.; Keith, T.; Al-Laham, M. A.; Peng, C. Y.; Nanayakkara, A.; Challacombe, M.; Gill, P. M. W.; Johnson, B.; Chen, W.; Wong, M. W.; Gonzalez, C.; Pople, J. A. Gaussian 03, Revision B. 03, Gaussian, Inc., Pittsburgh, PA, 2003.